



# 日立SEM+EDX 基礎セミナーと

## 新型卓上SEM+EDX測定会のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
この度、先端電子顕微鏡センター及びナノテク融合技術支援センターのご支援を賜り、下記の通りSEM+EDXの基礎セミナーと新型卓上SEM+EDX「TM4000Plus+Aztec」測定会を下記の通り開催致します。

この機会に奮ってご参加賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

### SEM+EDX基礎セミナー プログラム

共催 東北大学ナノテク融合技術支援センター

10:00-11:00	<b>SEMの原理と観察テクニック ～SEMで何ができるのか～</b>	(株)日立ハイテクノロジーズ
11:00-11:40	<b>EDXの原理と分析の基礎</b>	オックスフォード・インストルメンツ(株)

日時: 2017年 12月 20日(水) 10:00-12:00 SEM+EDX基礎セミナー  
13:00-17:30 卓上SEM測定会(1日 3組)  
2017年 12月 21日(木) 9:00-17:30 卓上SEM測定会(1日 5組)

場所:【セミナー】 金属材料研究所(3号館) 6階 セミナー室  
【卓上SEM測定会】 先端電子顕微鏡センター 1階(SU8000設置室)

予約: 下記の希望時間帯の番号をメールもしくは電話にて下記担当者までご連絡願います(セミナーのみの参加ご希望も承ります)

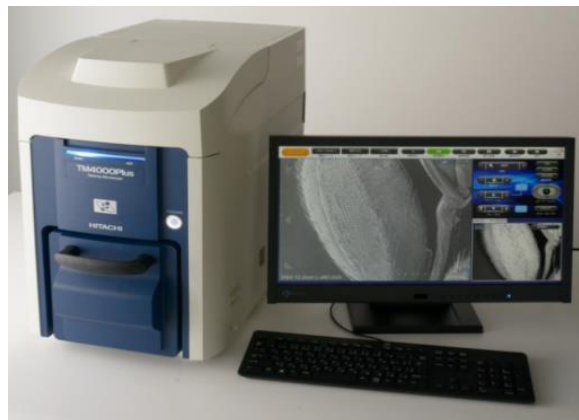
	20日	20日	20日	21日	21日	21日	21日	21日
希望日時	13:00 ~ 14:30	14:30 ~ 16:00	16:00 ~ 17:30	9:00 ~ 10:30	10:30 ~ 12:00	13:00 ~ 14:30	14:30 ~ 16:00	16:00 ~ 17:30
番号	1	2	3	4	5	6	7	8

【連絡先】 株式会社日立ハイテクノロジーズ 担当 青木(青木)

Mail: kenichiro.aoki.jp@hitachi-hightech.com

TEL: 050-3139-4976

### 【NEW 日立卓上顕微鏡TM4000Plus+EDX～卓上形走査電子顕微鏡】



特長:

- デジタルカメラ感覚の簡単撮影
- 低真空機能搭載、蒸着無しで試料観察&分析が可能
- 光学像とSEM像のリンクした視野探し機能(SEMマップ)

基本仕様:

- 加速電圧 : 5kV、10kV、15kV
- 倍率 : 25~250,000倍(モニター倍率)
- 検出器 : 二次電子検出器、反射電子検出器  
EDX検出器
- 試料サイズ : 80mm径、50mm高さ  
(観察範囲 X:40mm Y:35mm角)